

近年、各種材料の微細化や多機能構造を有する材料がめまぐるしく発展し、この各種材料の評価がクローズアップされてきております。この各種材料の表面や断面の評価手法として、おおきな威力を発揮するのが走査電子顕微鏡です。従来CCD デジタルスコープで観察を行っていた数千倍程度の観察を、焦点深度が深く、前処理なしで行える卓上低真空走査電子顕微鏡で行うことが着目され、大きな成果を挙げております。

当施設では最新卓上SEM**TM4000Plus II**を導入し、6/3(金)にメーカー講師によるセミナーを開催いたしました。今回は、セミナーの録画データを上映する場を設けたいと思います。セミナーに参加できなかった方、もう一度聞いてみたい方は是非ともご参加ください。

**参加無料**

日時	1回目2022年6月20日(月) 15:00~17:00 2回目2022年6月22日(水) 15:00~17:00
録画内容	電子顕微鏡 観察・分析における卓上低真空SEMの拡がる可能性 ～日立TM4000PlusIIの最新アプリケーション事例のご紹介～ 録画時間 2時間 講師 (株)日立ハイテク 上村 健氏
場 定 申	所 員 込 不要 工学部総合教育研究棟3階36教室 各回とも80名 ※原則として先着順とさせていただきます。

**問合せ先**

富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター  
自然科学研究支援ユニット 機器分析施設  
内線(6825) Tel: (076) 445-6825  
E-mail: yono@ctg.u-toyama.ac.jp

マスコットキャラクター  
ぶんせきっず